PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-002993

(43)Date of publication of application: 09.01.2001

(51)Int.CI.

C09D183/04 CO8L 33/02 C08L 83/04 C09D133/02

(21)Application number: 11-177695

(71)Applicant: JSR CORP

(22)Date of filing: 24.06.1999

(72)Inventor: KUROSAWA TAKAHIKO

HAYASHI EIJI KONNO KEIJI SHIODA ATSUSHI YAMADA KINJI **GOTO KOHEI**

(54) COMPOSITION FOR FORMING FILM, FORMATION OF FILM AND LOW- DENSITY FILM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a composition for forming a film which is curable at ≤450° C, provides a film having proper uniform thickness, dielectric constant characteristics, water absorption characteristics, excellent CMP resistance and a small void size, useful as interlayer dielectrics in a semiconductor element. SOLUTION: This composition for forming a film comprises (A) a compound of the formula, R2R3Si(OR1)2, a compound of the formula, R2Si(OR1)3 and/or a compound of the formula, Si(OR)4 and a compound of the formula, R2sR(R1 O)3-sSi(OR1)3-tR2t (R1 to R3 are each the same or different and a monofunctional organic group; R is a bifunctional organic group; and (s) and (t) are each an integer of 0-1), its hydrolyzate and/or its condensate, (B) a (meth)acrylate polymer and (C) at least one solvent selected from the group consisting of an alcohol-based solvent, a ketone-based solvent, an amide-based solvent and an ester-based solvent.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出廢公開番号 特開2001-2993

(P2001 - 2993A)

(43)公開日 平成13年1月9日(2001.1.9)

(51) Int.Cl. '	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
C 0 9 D 183/04		C 0 9 D 183/04	4 J 0 0 2
C 0 8 L 33/02		C 0 8 L 33/02	4J038
83/04		83/04	
C 0 9 D 133/02		C 0 9 D 133/02	

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 15 頁)

(21)出願番号	特願平11-177695	(71) 出願人	000004178	
• •			ジェイエスアール株式会社	
(22)出願日	平成11年6月24日(1999.6.24)	!	東京都中央区築地2丁目11番24号	
		(72)発明者	黒澤 孝彦	
			東京都中央区築地二丁目11番24号	ジェイ
		İ	エスアール株式会社内	
		(72)発明者	林 英治	
			東京都中央区築地二丁目11番24号	ジェイ
			エスアール株式会社内	
		(74)代理人	100085224	
			弁理士 白井 重隆	

最終頁に続く

(54) [発明の名称] 膜形成用組成物、膜の形成方法および低密度化膜

(57)【要約】

【課題】 450℃以下での硬化可能であり、得られる 膜が適当な均一な厚さを有し、誘電率特性、吸水性特性 に優れ、CMP耐性に優れ、かつ空隙サイズが小さく、 半導体素子などにおける層間絶縁膜として有用な、膜形 成用組成物を提供する。

【解決手段】 (A) R'R'Si (OR'), R'Si (OR'), R'Si (OR'), および/またはSi (OR'), ならびにR', (R'O), SiRSi (OR'), R' (R'~Rは同一でも異なっていてもよく、それぞれ1価の有機基、Rは2価の有機基を示し、sおよびtは0~1の整数である)で表される化合物、これらの加水分解物および/またはこれらの縮合物、(B) (メタ)アクリレート系重合体、ならびに(C)アルコール系溶媒、ケトン系溶媒、アミド系溶媒およびエステル系溶媒の群から選ばれた少なくとも1種の溶媒、を含有する膜形成用組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) (A-1)下記—般式(1)で表される化合物、および/または(A-2)下記—般式

- (2) で表される化合物、および/または(A-3)下記一般式(3) で表される化合物、ならびに、(A-4) 下記一般式(4) で表される化合物、その加水分解
- 4) 下記一般式 (4) で表される化合物、その加水分解 物および/またはその縮合物、

R' R' S i (OR'), (1) R' S i (OR'), (2) S i (OR'), (3) R', $(R' O)_{1-}, S i R S i (OR')_{3-}, R'$, (4)

(R'~R は同一でも異なっていてもよく、それぞれ 1価の有機基、Rは2価の有機基を示し、sおよびtは 0~1の整数である。)

- (B) アルコキシシリル基を有するラジカル重合性モノマーを0.1~10モル%含むモノマーを重合してなる (メタ) アクリレート系重合体 ならびに
- (C) アルコール系溶媒、ケトン系溶媒、アミド系溶媒 およびエステル系溶媒の群から選ばれた少なくとも1種 の溶媒を含有することを特徴とする膜形成用組成物。

【請求項2】 (A) 成分中、完全加水分解縮合物に換算した各成分の割合で、(A-4)/{〔(A-1)、(A-2) および/または(A-3)]+(A-4)}が5~50重量%であり{ただし、〔(A-1)、(A-2) および/または(A-3)]+(A-4)=100重量%}、かつ(A-1)<(A-2)、かつ(A-3)<(A-2)である請求項1記載の膜形成用組成物。

【請求項3】 (B) (メタ) アクリレート系重合体の 溶解度パラメーターが $9\sim1$ 3 である請求項 1 記載の膜 形成用組成物。

【請求項4】 (B) (メタ) アクリレート系重合体が、炭素数12以下の脂肪族アクリレートおよび/またはメタクリレートを50モル%以上含むことを特徴とする請求項1記載の膜形成用組成物。

【請求項5】 請求項1~4いずれか1項記載の膜形成 用組成物を基板に塗布し、加熱することを特徴とする膜 の形成方法。

【請求項6】 請求項1~4いずれか1項記載の膜形成用組成物を基板に塗布し、(B) 成分の分解温度未満の温度で加熱して(A) 成分を一部硬化させ、次いで上記(B) 成分の分解温度以上の温度で加熱を行い硬化させる請求項5記載の膜の形成方法。

【請求項7】 請求項1~4いずれか1項記載の膜形成 用組成物を基板に塗布し、(B) 成分の分解温度以上の 温度で加熱を行い硬化させる請求項5記載の膜の形成方 法。

【請求項8】 請求項5~7いずれか1項記載の膜の形成方法によって得られる低密度化膜。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、膜形成用組成物に関し、さらに詳しくは、450℃以下での硬化が可能な組成物であって、半導体素子などにおける層間絶縁膜材料として、誘電率特性、吸水性特性、CMP耐性に優れ、かつ空隙サイズが小さい塗膜が形成可能な膜形成用組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、半導体素子などにおける層間絶縁膜として、CVD法などの真空プロセスで形成されたシリカ(SiO」)膜が多用されている。そして、近年、より均一な層間絶縁膜を形成することを目的として、SOG(Spin on Glass)膜と呼ばれるテトラアルコキシランの加水分解生成物を主成分とする塗布型の絶縁膜も使用されるようになっている。また、半導体素子などの高集積化に伴い、有機SOGと呼ばれるポリオルガノシロキサンを主成分とする低誘電率の層間絶縁膜が開発されている。しかしながら、半導体素子などのさらなる高集積化や多層化に伴い、より優れた導体間の電気絶縁性が要求されており、したがって、より低誘電率でかつクラック耐性に優れる層間絶縁膜材料が求められるようになっている。

【0003】そこで、特開平6—181201号公報には、層間絶縁膜材料として、より低誘電率の絶縁膜形成用塗布型組成物が開示されている。この塗布型組成物は、吸水性が低く、耐クラック性に優れた半導体装置の絶縁膜を提供することを目的としており、その構成は、チタン、ジルコニウム、ニオブおよびタンタルから選ばれる少なくとも1種の元素を含む有機金属化合物と、分子内にアルコキシ基を少なくとも1個有する有機ケイ素化合物とを縮重合させてなる、数平均分子量が500以上のオリゴマーを主成分とする絶縁膜形成用塗布型組成物である。しかしながら、従来の無機系層間絶縁膜材料の誘電率は、3.0以上であり、高集積化には不充分である。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題点を解決するための膜形成用組成物に関し、さらに詳しくは、低温で硬化可能であり、得られる塗膜が、半導体素子などにおける層間絶縁膜として、適当な均一な厚さを有し、誘電率特性、吸水性特性、CMP耐性に優れ、かつ空隙サイズが小さい、膜形成用組成物を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、(A) (A—1) 下記一般式(1) で表される化合物(以下「化合物(1)」ともいう)、および/または(A—2)下記一般式(2)で表される化合物(以下「化合物(2)」ともいう)、および/または(A—3)下記一般式(3)

で表される化合物(以下「化合物(3)」ともいう)、ならびに、(A-4)下記一般式(4)で表される化合物(以下「化合物(4)」ともいう)、その加水分解物および/またはその縮合物(以下それぞれ「(A-1)成分」「(A-2)成分」「(A-3)成分」「(A-4)成分」ともいう)、

 $R^{1}R^{1}Si(OR^{1})$,(1) $R^{1}Si(OR^{1})$,(2) $Si(OR^{1})$,(3) R^{1} , $(R^{1}O)$, $SiRSi(OR^{1})$, R^{2} ,(4)

(R'~Rは同一でも異なっていてもよく、それぞれ 1価の有機基、Rは2価の有機基を示し、sおよびtは 0~1の整数である。ただし、一般式(4)において、 4~6個のRは、同一でも異なっていてもよい。〕

- (B) アルコキシシリル基を有するラジカル重合性モノマーを0.1~10モル%含むモノマーを重合してなる (メタ) アクリレート系重合体、ならびに
- (C) アルコール系溶媒、ケトン系溶媒、アミド系溶媒 およびエステル系溶媒の群から選ばれた少なくとも1種 の溶媒を含有することを特徴とする膜形成用組成物に関 する。ここで、(A)成分中、完全加水分解縮合物に換 算した各成分の割合で、(A-4)/{〔(A-1)、 (A-2) および/または (A-3)] + (A-4) } が5~50重量%であり {ただし、〔(A-1)、(A -2) および/または (A-3)) + (A-4) = 10 0重量%}、かつ(A-1) < (A-2)、かつ(A-3) < (A-2) であることが好ましい。また、(B) (メタ) アクリレート系重合体は、アルコキシシリル基 を含有するモノマーを0.1~10モル%共重合してな り、かつ溶解度パラメーターが9~13であることが好 ましい。さらに、(B) (メタ) アクリレート系重合体 は、炭素数12以下の脂肪族アクリレートおよび/また はメタクリレートを50モル%以上含むことが好まし い。次に、本発明は、上記膜形成用組成物を基板に塗布 し、加熱することを特徴とする膜の形成方法に関する。 ここで、上記膜の形成方法としては、①上記膜形成用組 成物を基板に塗布し、(B)成分の分解温度未満の温度 で加熱して (A) 成分を一部硬化させ、次いで上記
- (B) 成分の分解温度以上の温度で加熱を行い硬化させるか、②上記膜形成用組成物を基板に塗布し、(B) 成分の分解温度以上の温度で加熱を行い硬化させることが好ましい。次に、本発明は、上記膜の形成方法によって得られる低密度化膜に関する。

[0006]

【発明の実施の形態】本発明は、膜を形成するベースポリマーとして、(A)成分(化合物(1)~(3)、これらの加水分解物および/またはこれらの縮合物)を、また多孔質を形成する材料として(B)(メタ)アクリレート系重合体を用い、(A)~(B)成分の溶剤とし

て(C) 溶媒を用いる。かくて、(A) ~ (C) 成分を 含有する本発明の組成物は、450℃以下での硬化が可能な組成物であり、この組成物を、浸漬またはスピンコート法などにより、シリコンウエハなどの基材に塗布し、そして、加熱により、(B) (メタ)アクリレート系重合体および(C)溶媒の除去と、(A)成分の熱重 縮合を行なうと、(A)成分がガラス質または巨大高分子の膜を形成するとともに、(B) (メタ)アクリレート系重合体が分解・除去されることにより、微細孔が形成される。得られる膜は、塗膜均一性に優れ、空隙サイズが小さい多孔質の低密度膜であり、誘電率が低く、C MP耐性が良好であり、低吸水性のため電気的特性の安定性に優れ、層間絶縁膜材料を形成することができる。 【0007】ここで、(A)成分における上記加水分解物とは、上記(A)成分を構成する化合物(1)~

(4)中のR¹O―基すべてが加水分解されている必要はなく、例えば、1個だけが加水分解されているもの、2個以上が加水分解されているもの、あるいは、これらの混合物であってもよい。また、(A)成分における上記縮合物は、(A)成分の加水分解物のシラノール基が縮合してSiーO―Si結合を形成したものであるが、本発明では、シラノール基がすべて縮合している必要はなく、僅かな一部のシラノール基が縮合したもの、縮合の程度が異なっているものの混合物などをも包含した概念である。

【0008】以下、本発明に用いられる(A)~(C)成分などについて説明し、次いで、本発明の組成物の調製方法などについて詳述する。

【0009】(A)成分

(A) 成分は、4~6個のRO—基を有する (A— 4) 成分を必須成分として使用し、これに (A-1)、 (A-2) および/または (A-3) を併用する。本発 明において、(A-4)成分を用いることにより、特に CMP耐性が良好となる。上記一般式(1)~(4)に おいて、R'~Rは、同一でも異なっていてもよく、 それぞれ1価の有機基をである。この1価の有機基とし ては、アルキル基、アリール基、アリル基、グリシジル 基などを挙げることができる。ここで、アルキル基とし ては、メチル基、エチル基、プロビル基、プチル基など が挙げられ、好ましくは炭素数1~5であり、これらの アルキル基は鎖状でも、分岐していてもよく、さらに水 素原子がフッ素原子などに置換されていてもよい。一般 式(1)~(4)において、アリール基としては、フェ ニル基、ナフチル基、メチルフェニル基、エチルフェニ ル基、クロロフェニル基、プロモフェニル基、フルオロ フェニル基などを挙げることができる。

【0010】一般式(1)で表される化合物の具体例としては、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジエトキシシラン、ジメチルージーnープロポキシシラン、ジメチルージー チルージーiso一プロポキシシラン、ジメチルージー

n-ブトキシシラン、ジメチル-ジ-sec-ブトキシ シラン、ジメチルージーtertープトキシシラン、ジ メチルジフェノキシシラン、ジエチルジメトキシシラ ン、ジエチルジエトキシシラン、ジエチル**ー**ジーnープ ロポキシシラン、ジエチルージーisoープロポキシシ ラン、ジェチルージーnープトキシシラン、ジェチルー ジーsecープトキシシラン、ジエチルージーtert **一プトキシシラン、ジエチルジフェノキシシラン、ジー** nープロピルジメトキシシラン、ジーnープロピルジエ トキシシラン、ジーn-プロピル-ジ-n-プロポキシ シラン、ジーnープロピルージーisoープロポキシシ ラン、ジーn-プロピル-ジーn-プトキシシラン、ジ -n-プロピルージーsec-ブトキシシラン、ジーn ープロピルージーtertープトキシシラン、ジーnー プロピルージーフェノキシシラン、ジーisoープロピ ルジメトキシシラン、ジーiso-プロピルジエトキシ シラン、シーisoープロビルージーnープロポキジシ ラン、ジーisoープロピルージーisoープロポキシ シラン、ジーisoープロピルージーnーブトキシシラ ン、ジー150-プロピルージー5ec-プトキシシラ ン、ジーiso-プロピルージーtert-ブトキシシ ラン、ジーiso-プロピル-ジ-フェノキシシラン、 ジーnーブチルジメトキシシラン、ジーnーブチルジエ トキシシラン、ジ--n--ブチル--ジ--n--プロポキシシ ラン、ジーnープチルージーisoープロポキシシラ ン、ジ—n—ブチル—ジ—n—ブトキシシラン、ジ—n *─ブチル*─ジ─sec─ブトキシシラン、ジ─n─ブチ ルージーtertーブトキシシラン、ジーnーブチルー ジーフェノキシシラン、ジーsecーブチルジメトキシ シラン、ジーsecープチルジエトキシシラン、ジーs ecーブチルージーnープロポキシシラン、ジーsec *―ブチル―ジ―*iso―プロポキシシラン、ジ―sec -ブチル-ジ-n-ブトキシシラン、ジ-s e c-ブチ ルージーsecーブトキシシラン、ジーsecーブチル ージーtertープトキシシラン、ジーsecープチル ―ジーフェノキシシラン、ジーtertーブチルジメト キシシラン、ジ―t e r t ―ブチルジエトキシシラン、 ジーtert一ブチルージーn一プロポキシシラン、ジ ーt e r tープチルージーi s oープロポキシシラン、 ジーtertープチルージーnーブトキシシラン、ジー tertーブチルージーsecープトキシシラン、ジー tert-ブチル-ジーtert-ブトキシシラン、ジ ーtertーブチルージーフェノキシシラン、ジフェニ ルジメトキシシラン、ジフェニル-ジ-エトキシシラ ン、ジフェニル**ー**ジーnープロポキシシラン、ジフェニ ルージーisoープロポキシシラン、ジフェニルージー nーブトキシシラン、ジフェニルージーsecーブトキ シシラン、ジフェニル―ジ―tert―ブトキシシラ ン、ジフェニルジフェノキシシランなどが挙げられる。 【0011】また、一般式(2)で表される化合物の具

体例としては、メチルトリメトキシシラン、メチルトリ エトキシシラン、メチルトリーn-プロポキシシラン、 メチルトリーisoープロポキシシラン、メチルトリー n-ブトキシシラン、メチルトリ-sec-ブトキシシ ラン、メチルトリーtertーブトキシシラン、メチル トリフェノキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エ チルトリエトキシシラン、エチルトリ—n—プロポキシ シラン、エチルトリーisoープロポキシシラン、エチ ルトリーnーブトキシシラン、エチルトリーsecーブ トキシシラン、エチルトリーtertーブトキシシラ ン、エチルトリフェノキシシラン、n-プロピルトリメ トキシシラン、nープロピルトリエトキシシラン、nー プロビルトリーnープロポキシシラン、nープロビルト リーiso-プロポキシシラン、n-プロピルトリーn **―ブトキシシラン、n―プロピルトリ―sec─ブトキ** シシラン、n-プロピルトリ-tert-ブトキシシラ ン、n-プロビルトリフェノキシシラン、i-プロビル トリメトキシシラン、i-プロピルトリエトキシシラ ン、iープロピルトリーnープロポキシシラン、iープ ロビルトリーisoープロポキシシラン、iープロビル トリーnープトキシシラン、iープロピルトリーsec 一プトキシシラン、i一プロピルトリーtert一プト キシシラン、i-プロピルトリフェノキシシラン、n-プチルトリメトキシシラン、n―プチルトリエトキシシ ラン、n-ブチルトリ-n-プロポキシシラン、n-ブ チルトリーisoープロポキシシラン、nープチルトリ ─n─ブトキシシラン、n─ブチルトリ─sec─ブト キシシラン、n-ブチルトリーtert-ブトキシシラ ン、n-ブチルトリフェノキシシラン、sec-ブチル トリメトキシシラン、sec-ブチル--トリエトキシシ ラン、sec--ブチル--トリ--n-プロポキシシラン、 secーブチルートリーisoープロポキシシラン、s ecープチルートリーnープトキシシラン、secーブ チルートリーsecーブトキシシラン、secーブチル ートリーtert--ブトキシシラン、sec--ブチルー トリフェノキシシラン、tーブチルトリメトキシシラ ン、t-ブチルトリエトキシシラン、t-ブチルトリー n-プロポキシシラン、t-ブチルトリーiso-プロ ポキシシラン、t-ブチルトリーn-ブトキシシラン、 t—ブチルトリ—s e c—ブトキシシラン、t—ブチル トリーtertーブトキシシラン、tープチルトリフェ ノキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニル トリエトキシシラン、フェニルトリーnープロポキシシ ラン、フェニルトリーiso**--プロポキ**シシラン、フェ ニルトリーnープトキシシラン、フェニルトリーsec ─ブトキシシラン、フェニルトリ─tert─ブトキシ シラン、フェニルトリフェノキシシラン、などの他、ビ ニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、 γ-アミノプロピルトリメトキシシラン、γ-アミノブ ロビルトリエトキシシラン、 γ —グリシドキシプロビル

トリメトキシシラン、アーグリシドキシプロビルトリエトキシシラン、アートリフロロプロビルトリメトキシシラン、アートリフロロプロビルトリエトキシシランなどが挙げられる。

【0012】さらに、一般式(3)で表される化合物の 具体例としては、テトラメトキシシラン、テトラエトキ シシラン、テトラーn一プロポキシシラン、テトラーi so一プロポキシシラン、テトラーn一ブトキシラン、 テトラーsecーブトキシシラン、テトラーtertー ブトキシシラン、テトラフェノキシシランなどが挙げら れる。

【0013】化合物(1)~(3)のうち、好ましくは、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テトラー1so一プロポキシシラン、メチルトリエトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、メチルトリー1so一プロポキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジフェニルジエトキシシラン、ジアエニルジストキシシラン、メチルトリストキシシラン、メチルトリストキシシラン、メチルトリエトキシシラン、ジメチルジストキシシラン、ジメチルジストキシシランである。これらは、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。

【0014】一方、上記一般式(4)において、Rは、2価の有機基を示し、sおよびtは0~1の整数を示す。ここで、上記一般式(4)において、2価の有機基としては、アルキレン基、アリーレン基などを挙げることができる。ここで、アルキレン基としては、メチレン基、エチレン基などが挙げられ、好ましくは炭素数1~2であり、さらに水素原子がフッ素原子などに置換されていてもよい。また、一般式(4)において、アリーレン基としては、フェニレン基、ナフタレン基などを挙げることができる。

【0015】一般式(4)で表される化合物の具体例としては、ピス(トリメトキシシリル)メタン、ピス(トリーループロポキシシリル)メタン、ピス(トリー・プロポキシシリル)メタン、ピス(トリー・ロープトキシシリル)メタン、ピス(トリー・ローブトキシシリル)メタン、ピス(トリー・ローブトキシシリル)メタン、ピス(トリー・ローブトキシシリル)メタンなどのピス(トリアルコキシシリル)メタン類;

【0016】1, 2—ビス(トリメトキシシリル)エタン、1, 2—ビス(トリエトキシシリル)エタン、1, 2—ビス(トリーn—プロポキシシリル)エタン、1, 2—ビス(トリーi—プロポキシシリル)エタン、1, 2—ビス(トリーn—プトキシシリル)エタン、1, 2—ビス(トリーsec—ブトキシシリル)エタン、1, 2—ビス(トリーt

1,2-ビス(トリアルコキシシリル)エタン類;
【0017】1-(ジメトキシメチルシリル)-1(トリメトキシシリル)メタン、1-(ジエトキシメチルシリル)ー1-(トリエトキシシリル)メタン、1-(ジーnープロポキシメチルシリル)ー1-(トリーnープロポキシシリル)メタン、1-(ジーiープロポキシシリル)メタン、1-(ジーiープロポキシシリル)メタン、1-(ジーnーブトキシメチルシリル)ー1-(トリーnーブトキシシリル)メタン、1-(ジーsecーブトキシメチルシリル)ー1-(トリーsecーブトキシシリル)メタン、1-(ジーtーブトキシメチルシリル)ー1-(トリーsecーブトキシシリル)メタン、1-(ジーtーブトキシメチルシリル)ー1-(トリーtーブトキシシリル)メタンなどの1-(ジアルコキシメチルシリル)ー1-(トリアルコキシシリル)メタン類;

【0019】 ピス (ジメトキシメチルシリル) メタン、 ピス (ジェトキシメチルシリル) メタン、ピス (ジーn ─プロポキシメチルシリル)メタン、ピス(ジーiープ ロポキシメチルシリル) メタン、ビス (ジーnーブトキ シメチルシリル) メタン、ピス (ジーsecーブトキシ メチルシリル) メタン、ピス (ジーtーブトキシメチル シリル) メタンなどのビス (ジアルコキシメチルシリ ル) メタン類; 1, 2-ビス (ジメトキシメチルシリ ル) エタン、1, 2-ビス (ジェトキシメチルシリル) エタン、1,2-ビス(ジーn-プロポキシメチルシリ μ) エタン、1, 2—ビス (ジーi—プロポキシメチル シリル) エタン、1, 2-ビス (ジ-n-ブトキシメチ ルシリル) エタン、1,2-ビス (ジーsec-ブトキ シメチルシリル) エタン、1,2-ビス (ジーtープト キシメチルシリル) エタンなどの1, 2-ビス (ジアル コキシメチルシリル) エタン類;

【0020】1,2—ビス(トリメトキシシリル)ベンゼン、1,2—ビス(トリエトキシシリル)ベンゼン、1,2—ビス(トリーn—プロポキシシリル)ベンゼン、1,2—ビス(トリー・i一プロポキシシリル)ベンゼン、1,2—ビス(トリー・n—ブトキシシリル)ベンゼン、1,2—ビス(トリー・sec—ブトキシシリル)ベンゼン、1,2—ビス(トリー・ナトキンシリル)ベ

ンゼン、1,3-ビス (トリメトキシシリル) ベンゼ ン、1、3-ビス (トリエトキシシリル) ベンゼン、 1, 3-ビス (トリーn-プロポキシシリル) ベンゼ ン、1,3-ビス(トリーi-プロポキシシリル)ベン ゼン、1、3-ビス (トリーn-ブトキシシリル) ペン ゼン、1,3-ビス(トリーsec-ブトキシシリル) ベンゼン、1, 3-ビス (トリーtーブトキシシリル) ベンゼン、1, 4一ピス (トリメトキシシリル) ベンゼ ン、1、4-ビス (トリエトキシシリル) ベンゼン、 1、4-ビス (トリーnープロポキシシリル) ベンゼ ン、1,4-ビス(トリーi-プロポキシシリル)ベン ゼン、1,4-ビス (トリーn-ブトキシシリル) ベン ゼン、1,4-ビス(トリーsec-ブトキシシリル) ベンゼン、1, 4-ビス (トリーt-ブトキシシリル) ベンゼンなどのピス (トリアルコキシシリル) ベンゼン 類;などを挙げることができる。これらの化合物(4) は、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。 【0021】上記化合物(4)中では、ピス(トリメト キシシリル) メタン、ピス (トリエトキシシリル) メタ ンなどのピス (トリアルコキシシリル) メタン;1,2 **―ビス (トリメトキシシリル) エタン、1,2―ビス** (トリエトキシシリル) エタンなどの1, 2-ビス (ト リアルコキシシリル) エタン;1— (ジメトキシメチル シリル) ―1― (トリメトキシシリル) メタン、1― (ジェトキシメチルシリル) -1- (トリエトキシシリ ル) メタンなどの1一 (ジアルコキシメチルシリル) 一 1- (トリアルコキシシリル) メタン; 1- (ジメトキ シメチルシリル) -2- (トリメトキシシリル) エタ ン、1-(ジェトキシメチルシリル)-2-(トリエト キシシリル) エタンなどの1-(ジアルコキシメチルシ リル) -2- (トリアルコキシシリル) エタン; 【0022】 ピス (ジメトキシメチルシリル) メタン、 ヒス (ジェトキシメチルシリル) メタンなどのビス (ジ アルコキシメチルシリル) メタン;1,2-ビス(ジメ トキシメチルシリル) エタン、1,2一ピス (ジエトキ シメチルシリル) エタンなどの1,2-ビス (ジアルコ キシメチルシリル) エタン;1, 2-ビス (トリメトキ シシリル) ベンゼン、1,2--ビス(トリエトキシシリ ル) ベンゼン、1,3-ビス (トリメトキシシリル) ベ ンゼン、1,3-ビス(トリエトキシシリル)ペンゼ ン、1、4-ビス (トリメトキシシリル) ベンゼン、 1, 4-ビス (トリエトキシシリル) ベンゼンなどのビ ス (トリアルコキシシリル) ベンゼン;が好ましく、特 にビス (トリメトキシシリル) メタン、ビス (トリエト キシシリル) メタンなどのビス (トリアルコキシシリ ル) メタン; 1, 2-ビス (トリメトキシシリル) エタ ン、1,2-ビス(トリエトキシシリル)エタンなどの 1, 2-ピス (トリアルコキシシリル) エタンが好まし

【0023】上記(A)成分を構成する化合物(1)~

(4)を加水分解、縮合させる際に、R'O―で表される基1モル当たり、0.25~3モルの水を用いることが好ましく、0.3~2.5モルの水を加えることが特に好ましい。添加する水の量が0.25~3モルの範囲内の値であれば、塗膜の均一性が低下する恐れが無く、また、加水分解及び部分縮合反応中のポリマーの析出やゲル化の恐れが少ないためである。

【0024】(A)成分を構成する化合物(1)~

(4) を加水分解、縮合させる際には、触媒を使用して もよい。この際に使用する触媒としては、金属キレート 化合物、有機酸、無機酸、有機塩基、無機塩基を挙げる ことができる。

【0025】金属キレート化合物としては、例えば、ト リエトキシ・モノ (アセチルアセトナート) チタン、ト リーnープロポキシ・モノ (アセチルアセトナート) チ タン、トリー1-プロポキシ・モノ (アセチルアセトナ ート) チタン、トリーnープトキシ・モノ (アセチルア セトナート) チタン、トリーsecーブトキシ・モノ (アセチルアセトナート) チタン、トリーtーブトキシ ・モノ (アセチルアセトナート) チタン、ジエトキシ・ ビス (アセチルアセトナート) チタン、ジーnープロポ キシ・ビス (アセチルアセトナート) チタン、ジー1-プロポキシ・ピス (アセチルアセトナート) チタン、ジ -n-ブトキシ・ピス (アセチルアセトナート) チタ ン、ジーsecープトキシ・ピス (アセチルアセトナー ト) チタン、ジーtーブトキシ・ピス (アセチルアセト ナート) チタン、モノエトキシ・トリス (アセチルアセ トナート) チタン、モノーnープロポキシ・トリス (ア セチルアセトナート) チタン、モノ―i―プロポキシ・ トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノーnープ トキシ・トリス (アセチルアセトナート) チタン、モノ -sec-ブトキシ・トリス(アセチルアセトナート) チタン、モノーt — ブトキシ・トリス (アセチルアセト ナート) チタン、テトラキス (アセチルアセトナート) チタン、トリエトキシ・モノ (エチルアセトアセテー ト) チタン、トリーnープロポキシ・モノ (エチルアセ トアセテート) チタン、トリー1-プロポキシ・モノ (エチルアセトアセテート) チタン、トリーnープトキ シ・モノ (エチルアセトアセテート) チタン、トリーs e cーブトキシ・モノ (エチルアセトアセテート) チタ ン、トリーtーブトキシ・モノ(エチルアセトアセテー ト) チタン、ジェトキシ・ビス (エチルアセトアセテー ト) チタン、ジーnープロポキシ・ビス (エチルアセト アセテート) チタン、ジーiープロポキシ・ビス (エチ ルアセトアセテート) チタン、ジ-n-ブトキシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、ジーsecーブト キシ・ビス (エチルアセトアセテート) チタン、ジーt ーブトキシ・ピス (エチルアセトアセテート) チタン、 モノエトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) チタ ン、モノーnープロポキシ・トリス (エチルアセトアセ

テート) チタン、モノーiープロポキシ・トリス (エチ ルアセトアセテート) チタン、モノ—n—ブトキシ・ト リス (エチルアセトアセテート) チタン、モノーSec ープトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) チタ ン、モノーtーブトキシ・トリス (エチルアセトアセテ ート) チタン、テトラキス(エチルアセトアセテート) チタン、モノ (アセチルアセトナート) トリス (エチル アセトアセテート) チタン、ピス (アセチルアセトナー ト) ピス (エチルアセトアセテート) チタン、トリス (アセチルアセトナート) モノ (エチルアセトアセテー ト) チタンなどのチタンキレート化合物; 【0026】トリエトキシ・モノ(アセチルアセトナー ト) ジルコニウム、トリーnープロポキシ・モノ (アセ チルアセトナート) ジルコニウム、トリーiープロポキ シ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコニウム、トリ -n-ブトキシ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコ ニウム、トリーsecーブトキシ・モノ (アセチルアセ トナート) ジルコニウム、トリ―t*―*プトキシ・モノ (アセチルアセトナート) ジルコニウム、ジエトキシ・ ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、ジーnー・ プロポキシ・ピス (アセチルアセトナート) ジルコニウ ム、ジー1一プロポキシ・ビス (アセチルアセトナー ト) ジルコニウム、ジーnープトキシ・ビス (アセチル アセトナート) ジルコニウム、ジーsec—ブトキシ・ ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、ジーtー ブトキシ・ビス (アセチルアセトナート) ジルコニウ ム、モノエトキシ・トリス (アセチルアセトナート) ジ ルコニウム、モノ**ー**n―プロポキシ・トリス(アセチル アセトナート) ジルコニウム、モノー i ープロポキシ・ トリス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、モノー n-ブトキシ・トリス (アセチルアセトナート) ジルコ ニウム、モノーsecーブトキシ・トリス (アセチルア セトナート) ジルコニウム、モノ**ー**t ―ブトキシ・トリ ス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、テトラキス (アセチルアセトナート) ジルコニウム、トリエトキシ ・モノ (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリ ーnープロポキシ・モノ (エチルアセトアセテート) ジ ルコニウム、トリー1-プロポキシ・モノ (エチルアセ トアセテート) ジルコニウム、トリーカープトキシ・モ ノ (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリーs e cーブトキシ・モノ (エチルアセトアセテート) ジル コニウム、トリーtーブトキシ・モノ (エチルアセトア セテート) ジルコニウム、ジエトキシ・ビス (エチルア セトアセテート) ジルコニウム、ジー・ロープロポキシ・ ビス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、ジーi **―プロポキシ・ビス(エチルアセトアセテート)ジルコ** ニウム、ジーnープトキシ・ピス (エチルアセトアセテ ート) ジルコニウム、ジーsecーブトキシ・ビス (エ チルアセトアセテート) ジルコニウム、ジーセーブトキ シ・ビス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モ

ノエトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) ジルコ ニウム、モノ--n--プロポキシ・トリス (エチルアセト アセテート) ジルコニウム、モノー1ープロポキシ・ト リス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モノー n-ブトキシ・トリス (エチルアセトアセテート) ジル コニウム、モノーsecーブトキシ・トリス(エチルア セトアセテート) ジルコニウム、モノ―t―ブトキシ・ トリス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、テト ラキス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、モノ (アセチルアセトナート) トリス (エチルアセトアセテ ート) ジルコニウム、ビス(アセチルアセトナート)ビ ス (エチルアセトアセテート) ジルコニウム、トリス (アセチルアセトナート) モノ (エチルアセトアセテー ト) ジルコニウムなどのジルコニウムキレート化合物; 【0027】トリス(アセチルアセトナート)アルミニ ウム、トリス (エチルアセトアセテート) アルミニウム などのアルミニウムキレート化合物;などを挙げること ができる。

【0028】有機酸としては、例えば、酢酸、プロピオー ン酸、ブタン酸、ベンタン酸、ヘキサン酸、ヘプタン 酸、オクタン酸、ノナン酸、デカン酸、シュウ酸、マレ イン酸、メチルマロン酸、アジピン酸、セバシン酸、没 食子酸、酪酸、メリット酸、アラキドン酸、シキミ酸、 2-エチルヘキサン酸、オレイン酸、ステアリン酸、リ ノール酸、リノレイン酸、サリチル酸、安息香酸、p-アミノ安息香酸、p-トルエンスルホン酸、ペンゼンス ルホン酸、モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ 酢酸、トリフルオロ酢酸、ギ酸、マロン酸、スルホン 酸、フタル酸、フマル酸、クエン酸、酒石酸などを挙げ ることができる。無機酸としては、例えば、塩酸、硝 酸、硫酸、フッ酸、リン酸などを挙げることができる。 【0029】有機塩基としては、例えば、ピリジン、ピ ロール、ピペラジン、ピロリジン、ピペリジン、ピコリ ン、トリメチルアミン、トリエチルアミン、モノエタノ ールアミン、ジエタノールアミン、ジメチルモノエタノ ールアミン、モノメチルジエタノールアミン、トリエタ ノールアミン、ジアザビシクロオクラン、ジアザビシク ロノナン、ジアザビシクロウンデセン、テトラメチルア ンモニウムハイドロオキサイドなどを挙げることができ る。無機塩基としては、例えば、アンモニア、水酸化ナ トリウム、水酸化カリウム、水酸化パリウム、水酸化カ ルシウムなどを挙げることができる。

【0030】これら触媒のうち、金属キレート化合物、 有機酸、無機酸が好ましく、より好ましくは、有機酸を 挙げることができる。有機酸としては、特に酢酸、シュ ウ酸、マレイン酸、マロン酸が好ましい。触媒として、 有機酸を用いると、加水分解及び部分縮合反応中のポリ マーの析出やゲル化の恐れが少なく好ましい。これらの 触媒は、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよ

15

【0031】上記触媒の使用量は、化合物(1)~(4)のR'O—で表される基の総量1モルに対して、通常、0.00001~0.05モル、好ましくは0.0001~0.01モルである。

【0032】 (A) 成分が、化合物(1)~(4) の縮合物である場合には、その分子量は、ポリスチレン換算の重量平均分子量で、通常、500~300, 000、好ましくは、500~200, 000、さらに好ましくは1, 000~100, 000程度である。

【0033】また、(A) 成分中の(A-1)~(A-4) の割合は、完全加水分解縮合物に換算した各成分の 割合で、 (A-4) / { ((A-1) 、 (A-2) およ び/または (A-3)] + (A-4) } が5~50重量 %、好ましくは5~45重量%、特に好ましくは10~ 45重量%であり {ただし、〔(A-1)、(A-2) および/または (A-3)] + (A-4) = 100 重量 % , bo (A-1) < (A-2) , bo (A-3) <(A-2) である。 完全加水分解縮合物に換算した各成 分の割合で、(A-4)/{((A-1)、(A-2) および/または (A-3)) + (A-4) } が5 重量% 未満では得られる塗膜の機械的強度が低下し、またCM P耐性が不良となる。一方、50重量%を超えると吸水 性が高くなり得られる塗膜の電気的特性が低下する。な お、本発明において、完全加水分解縮合物とは、化合物 (1)~(3)のSiOR基が100%加水分解して SiOH基となり、さらに完全に縮合してシロキサン構 造となったものをいう。

【0034】 (B) (メタ) アクリレート系重合体 本発明において、アルコキシシリル基を0.1~5モル %共重合してなる (メタ) アクリレート系重合体は、ア ルコキシシリル基とラジカル重合性不飽和二重結合を有 するモノマーとアクリル酸、メタクリル酸、アクリル酸 エステル、メタクリル酸エステルより構成される。

【0035】アルコキシシリル基とラジカル重合性不飽和二重結合をゆうするモノマーは、1分子中にアルコキシシリル基とラジカル重合性不飽和二重結合をおのおの1個以上有する化合物であり、特に限定されない。アルコキシシリル基とラジカル重合性不飽和二重結合を有するモノマーの具体例としては、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、ビニルトリブロポキシシラン、ビニルトリブトキシシラン、ビニルメチルジメトキシシラン、ビニルメチルジェトキシシラン、ビニルジメチルメトキシシラン、ビニルジメチルエトキシシランなどのビニルアルコキシシラン類;

【0036】アリルトリメトキシシラン、アリルトリエトキシシラン、アリルトリプロポキシシラン、アリルトリプトキシシラン、アリルメチルジメトキシシラン、アリルメチルジェトキシシラン、アリルジメチルメトキシシラン、アリルジメチルエトキシシランなどのアリルアルコキシシラン類;プテニルトリメトキシシラン、プテ

ニルトリエトキシシラン、ブテニルトリプロポキシシラン、ブテニルトリプトキシシラン、ブテニルメチルジメトキシシラン、ブテニルメチルジエトキシシラン、ブテニルジメチルエトキシシランなどのブテニルアルコキシシラン類;

【0037】(3—アクリロキシプロビル)トリメトキシシラン、(3—アクリロキシプロビル)トリエトキシシラン、(3—アクリロキシプロビル)トリプロポキシシラン、(3—アクリロキシプロビル)メチルジメトキシシラン、(3—アクリロキシプロビル)メチルジェトキシシラン、(3—アクリロキシプロビル)ジメチルメトキシシラン、(3—アクリロキシプロビル)ジメチルエトキシシランなどの(3—アクリロキシプロビル)アルコキシシラン類;

【0038】 (メタクリロキシメチル) トリメトキシシ ラン、 (メタクリロキシメチル) トリエトキシシラン、 (メタクリロキシメチル) トリプロポキシシラン、(メ タクリロキシメチル) トリプトキシシラン、(メタクリ ロキシメチル) メチルジメトキシシラン、(メタクリロ キシメチル) メチルジエトキシシラン、 (メタクリロキ シメチル) ジメチルメトキシシラン、 (メタクリロキシ メチル) ジメチルエトキシシランなどの (メタクリロキ シメチル) アルコキシシラン類; (2-メタクリロキシ エチル) トリメトキシシラン、(2-メタクリロキシエ チル) トリエトキシシラン、(2-メタクリロキシエチ ル) トリプロポキシシラン、(2-メタクリロキシエチ ル) トリプトキシシラン、(2-メタクリロキシエチ ル) メチルジメトキシシラン、(2-メタクリロキシエ チル) メチルジエトキシシラン、(2-メタクリロキシ エチル) ジメチルメトキシシラン、(2-メタクリロキ シエチル) ジメチルエトキシシランなどの (2-メタク リロキシエチル) アルコキシシラン類;

【0039】(3一メタクリロキシプロビル)トリメトキシシラン、(3一メタクリロキシプロビル)トリエトキシシラン、(3一メタクリロキシプロビル)トリプロポキシシラン、(3一メタクリロキシプロビル)トリプトキシシラン、(3一メタクリロキシプロビル)メチルジェトキシシラン、(3一メタクリロキシプロビル)メチルジェトキシシラン、(3一メタクリロキシプロビル)ジメチルエトキシシラン、(3一メタクリロキシプロビル)ジメチルエトキシシランなどの(3一メタクリロキシプロビル)ジメチルエトキシシランなどの(3一メタクリロキシプロビル)アルコキシシラン類;

【0040】(スチニルエチル)トリメトキシシラン、(スチニルエチル)トリエトキシシラン、(スチニルエチル)トリプロポキシシラン、(スチニルエチル)トリプトキシシラン、(スチニルエチル)メチルジメトキシシラン、(スチニルエチル)ジメチルメトキシシラン、(スチニルエチル)ジメチルメトキシシランなどの(スチニルエチル)ジメチルエトキシシランなどの(スチニルエ

チル) アルコキシシラン類;などが挙げられる。これら は、1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。 【0041】これらの中で、ビニルトリメトキシシラ ン、ビニルトリエトキシシラン、アリルトリメトキシシ ラン、アリルトリエトキシシラン、プテニルトリメトキ シシラン、ブテニルトリエトキシシラン (3一アクリロ キシプロピル) トリメトキシシラン、(3-アクリロキ シプロピル) トリエトキシシラン、 (メタクリロキシメ チル) トリメトキシシラン、 (メタクリロキシメチル) トリエトキシシラン、(2-メタクリロキシエチル)ト リメトキシシラン、(2―メタクリロキシエチル)トリ エトキシシラン、(3 ―メタクリロキシプロビル)トリ メトキシシラン、(3-メタクリロキシプロビル)トリ エトキシシラン、 (スチニルエチル) トリメトキシシラ ン、 (スチニルエチル) トリエトキシシラン、が特に好 ましい。

【0042】アクリル酸エステルの具体例としては、メ チルアクリレート、エチルアクリレート、nープロビル アクリレート、iso-プロビルアクリレート、n-ブ チルアクリレート、iso-ブチルアクリレート、se cープチルアクリレート、terープチルアクリレー ト、アミルアクリレート、ヘキシルアクリレート、ヘブ チルアクリレート、オクチルアクリレート、ノニルアク リレート、デシルアクリレート、ドデシルアクリレー ト、テトラデシルアクリレート、ヘキサデシルアクリレ ート、オクタデシルアクリレート、シクロヘキシルアク リレート、2-エチルヘキシルアクリレート、2-ヒド ロキシエチルアクリレート、ジエチレングリコールアク リレート、ポリエチレングリコールアクリレート、2一 メトキシエチルアクリレート、メトキシジエチレングリ コールアクリレート、メトキシポリエチレングリコール ・アクリレート、2-エトキシエチルアクリレート、エト キシジェチレングリコールアクリレート、エトキシポリ エチレングリコールアクリレート、2-ヒドロキシプロ ピルアクリレート、ジプロピレングリコールアクリレー ト、ポリプロピレングリコールアクリレート、2一メト キシプロピルアクリレート、メトキシジプロピレングリ コールアクリレート、メトキシポリプロピレングリコー ルアクリレート、2-エトキシプロピルアクリレート、 エトキシジプロピレングリコールアクリレート、エトキ シポリプロピレングリコールアクリレート、ベンジルア クリレート、フェニルカルビトールアクリレート、ノニ ルフェニルアクリレート、ノニルフェニルカルビトール アクリレート、2一ジメチルアミノエチルアクリレー ト、2-ジエチルアミノエチルアクリレート、n-ビニ ルピロリドン、ジシクロベンテニルオキシエチルアクリ レート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、イソボ ルニルアクリレート、グリシジルアクリレートなどのモ ノアクリレート類;

【0043】 エチレングリコールジアクリレート、ジエ

チレングリコールジアクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレート、1,3一ブチレングリコールジアクリレート、1,4一ブチレングリコールジアクリレート、ネオベンチルグリコールジアクリレート、1,6一へキサングリコールジアクリレート、2,2一ビス(4一アクリロキシブロビロキシフェニル)プロパン、2,2一ビス(4一アクリロキシジエトキシフェニル)プロパンなどのジアクリレート類;トリメチロールエタントリアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、ベンタエリスリトールトリアクリレートなどのトリアクリレート類;ベンタエリスリトールテトラアクリレートなどのテトラアクリレート類;などが挙げられる。これらは、1種または2種以上を同時に使用してもよい。

【0044】メタクリル酸エステルの具体例としては、 メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、nープ ロビルメタクリレート、iso一プロビルメタクリレー ト、nープチルメタクリレート、isoープチルメタク リレート、sec-ブチルメタクリレート、ter-ブ チルメタクリレート、アミルメタクリレート、ヘキシル メタクリレート、ヘプチルメタクリレート、オクチルメ タクリレート、ノニルメタクリレート、デシルメタクリ レート、ドデシルメタクリレート、テトラデシルメタク リレート、ヘキサデシルメタクリレート、オクタデシル メタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、2-エチルヘキシルメタクリレート、2-ヒドロキシエチル メタクリレート、ジエチレングリコールメタクリレー ト、ポリエチレングリコールメタクリレート、2一メト キシエチルメタクリレート、メトキシジエチレングリコ ールメタクリレート、メトキシポリエチレングリコール メタクリレート、2-エトキシエチルメタクリレート、 エトキシジエチレングリコールメタクリレート、エトキ シポリエチレングリコールメタクリレート、2一ヒドロ キシプロピルメタクリレート、ジプロピレングリコール メタクリレート、ポリプロピレングリコールメタクリレ ート、2-メトキシプロピルメタクリレート、メトキシ ジプロピレングリコールメタクリレート、メトキシポリ プロピレングリコールメタクリレート、2-エトキシブ ロビルメタクリレート、エトキシジプロビレングリコー ルメタクリレート、エトキシポリプロピレングリコール メタクリレート、ベンジルメタクリレート、フェニルカ ルビトールメタクリレート、ノニルフェニルメタクリレ ート、ノニルフェニルカルビトールメタクリレート、2 ―ジメチルアミノエチルメタクリレート、2―ジエチル アミノエチルメタクリレート、ジシクロペンテニルオキ シエチルメタクリレート、テトラヒドロフルフリルメタ クリレート、イソボルニルメタクリレート、グリシジル メタクリレートなどのモノメタクリレート類;

【0045】エチレングリコールジメタクリレート、ジェチレングリコールジメタクリレート、ポリエチレング

リコールジメタクリレート、ジプロピレングリコールジメタクリレート、ポリプロピレングリコールジメタクリレート、1,3一プチレングリコールジメタクリレート、1,4一プチレングリコールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジメタクリレート、1,6一へキサングリコールジメタクリレート、2,2一ピス(4ーメタクリロキシジエトキシフェニル)プロバンなどのジメタクリレート類;トリメチロールエタントリエタクリレート、トリメチロールプロバントリメタクリレートなどのトリメタクリレート類;などが挙げられる。これらは、1種または2種以上を同時に使用してもよい。

【0046】本発明において、アルコキシシリル基を有するラジカル重合性モノマーは、(メタ)アクリレート系重合体を構成する全モノマーに、通常、0.1~10 モル%、好ましくは0.1~8モル%の割合で含まれる。アルコキシシリル基を有するモノマーが0.1モル%未満の場合は得られる硬化物塗膜中の空隙のサイズが大きくなり微細配線間の層間絶縁膜材料として好ましくなく、10モル%を超える場合は加水分解及び部分縮合反応中にゲル化が生じやすくなり好ましくない。

【0047】本発明の膜形成用組成物において、(B) 成分中の上記アルコキシシリル基の一部または全部が上記(A) 成分と反応した状態で組成物中に存在することが好ましい。

【0048】本発明において、(メタ)アクリレート系重合体は、上記アクリル酸エステル、メタクリル酸エステルおよびアルコキシシリル基を有するモノマー以外のラジカル重合性モノマーを40モル%以下共重合していてもよい。ラジカル重合性モノマーとしては、アクリル酸、メタクリル酸などの不飽和カルボン酸、N,Nージメチルアクリルアミド、N,Nージメチルメタクリルアミドなどの不飽和アミド、アクリロニトリルなどの不飽和ニトリル、メチルビニルケトンなどの不飽和ケトン、スチレン、αーメチルスチレンなどの芳香族化合物などを挙げることができる。

【0049】本発明において、(メタ)アクリレート系 重合体のポリスチレン換算数平均分子量は、1,000 ~200,000、好ましくは1,000~50,00 0である。

【0050】また、本発明において、(メタ)アクリレート系重合体のSP値(溶解度パラメーター)は、好ましくは9 \sim 13である。SP値がこの範囲にあると、得られる塗膜の密度が低くなり低誘電となると共に、塗膜中の空隙サイズが小さい(<10 $\,$ nm、BJH法)ため、微細配線間の層間絶縁膜材料として好ましい。

【0051】本発明の(B) (メタ) アクリレート系重合体が、炭素数12以下の脂肪族アクリレートおよび/またはメタクリレートを50モル%以上含むことが好ましい。(B) (メタ) アクリレート系重合体として、この重合体を構成する(メタ) アクリル酸エステルをこの

ように限定することにより、450℃以下の温度で焼成 した場合に誘電率の低い硬化物が得られるため好まし い

【0052】(B) (メタ)アクリレート系重合体の使用量は、(A)成分(完全加水分解縮合物換算)100 重量部に対し、通常、1~80重量部、好ましくは5~ 65重量部である。1重量部未満では、誘電率を下げる 効果が小さく、一方、80重量部を超えると、機械的強度が低下する。

【0053】<u>(C)溶媒</u>

本発明の膜形成用組成物は、(A) 成分および(B) (メタ) アクリレート系重合体を、(C) アルコール 系、ケトン系、アミド系およびエステル系溶媒の群から 選ばれた少なくとも1種の溶媒に溶解または分散してな る。ここで、アルコール系溶媒としては、メタノール、 エタノール、nープロパノール、iープロパノール、n —ブタノール、i—ブタノール、sec—ブタノール、 tーブタノール、nーペンタノール、iーペンタノー ル、2-メチルブタノール、sec-ペンタノール、t **―ペンタノール、3―メトキシブタノール、n─ヘキサ** ノール、2-メチルペンタノール、sec-ヘキサノー ル、2—エチルブタノール、sec—ヘプタノール、 \wedge ブタノールー3、nーオクタノール、2*ー*エチルヘキサ ノール、sec-オクタノール、n-ノニルアルコー ル、2,6-ジメチルヘプタノール-4、n-デカノー ル、sec―ウンデシルアルコール、トリメチルノニル アルコール、secーテトラデシルアルコール、sec **―ヘプタデシルアルコール、フェノール、シクロヘキサ** ノール、メチルシクロヘキサノール、3,3,5-トリ メチルシクロヘキサノール、ベンジルアルコール、ジア セトンアルコールなどのモノアルコール系溶媒;

【0054】エチレングリコール、1,2一プロピレングリコール、1,3一プチレングリコール、ベンタンジオールー2,4、2一メチルベンタンジオールー2,4、ヘキサンジオールー2,5、ヘプタンジオールー2,4、2一エチルヘキサンジオールー1,3、ジエチレングリコール、シプロピレングリコール、トリエチレングリコール、トリプロピレングリコールなどの多価アルコール系溶媒;

【0055】エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノプロピルエーテル、エチレングリコールモノプチルエーテル、エチレングリコールモノフェニルエーテル、エチレングリコールモノー2ーエチルプチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノアロピルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、ジエチレングリコールモノスキシルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレン

グリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノブロピルエーテル、プロピレングリコールモノブチルエーテル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、ジプロピレングリコールモノブロピルエーテルなどの多価アルコール部分エーテル系溶媒は1種あるいは2種以上を同時に使用してもよい。

【0056】これらアルコールの内、 n一プロバノール、 i一プロバノール、 n一プタノール、 i一プタノール、 i一プタノール、 iープタノール、 nーペンタノール、 iーペンタノール、 2一メチルブタノール、 s e cーペンタノール、 tーペンタノール、 3ーメトキシブタノール、 nーヘキサノール、 2一メチルペンタノール、 s e cーヘキサノール、 2一エチルブタノール、 プロピレングリコールモノメチルエーテル、 プロピレングリコールモノブロピルエーテル、 プロピレングリコールモノブロピルエーテル、 プロピレングリコールモノブロピルエーテル、 プロピレングリコールモノブロピルエーテル、 プロピレングリコールモノブロピルエーテル、 プロピレングリコールモノブロピルエーテルなどが好ましい。

【0057】ケトン系溶媒としては、アセトン、メチル エチルケトン、メチル—n—プロピルケトン、メチル nーブチルケトン、ジエチルケトン、メチルーiーブチ ルケトン、メチル—n—ペンチルケトン、エチル—n— プチルケトン、メチル—n—ヘキシルケトン、ジーiー ブチルケトン、トリメチルノナノン、シクロヘキサノ ン、2-ヘキサノン、メチルシクロヘキサノン、2,4 一ペンタンジオン、アセトニルアセトン、アセトフェノ ン、フェンチョン、などの他、アセチルアセトン、2, 4-ヘキサンジオン、2, 4-ヘプタンジオン、3, 5 ―ヘプタンジオン、2,4一オクタンジオン、3,5一 オクタンジオン、2,4-ノナンジオン、3,5-ノナ ンジオン、5-メチル-2,4-ヘキサンジオン、2, 2, 6, 6ーテトラメチルー3, 5ーヘブタンジオン、 1, 1, 1, 5, 5, 5-ヘキサフルオロー2, 4-ヘ プタンジオンなどのβージケトン類などが挙げられる。 これらはケトン系溶媒は1種あるいは2種以上を同時に 使用してもよい。

【0058】アミド系溶媒としては、ホルムアミド、Nーメチルホルムアミド、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージエチルホルムアミド、Nーエチルホルムアミド、Nースチルアセトアミド、N, Nージメチルアセトアミド、Nーエチルアセトアミド、N, Nージエチルアセトアミド、Nーエチルアセトアミド、Nージエチルアセトアミド、Nーメチルプロピオンアミド、Nーメチルピロリドン、Nーホルミルピロリジン、Nーホルミルピロリジン、Nーアセチルピロリジンなどが挙げられる。これらはアミド系溶媒は1種あるいは2種以上を同時に使用してあよい。

【0059】エステル系溶媒としては、ジエチルカーボ

ネート、炭酸エチレン、炭酸プロピレン、炭酸ジエチ ル、酢酸メチル、酢酸エチル、γ-ブチロラクトン、γ *─*パレロラクトン、酢酸n─プロピル、酢酸i─プロピ ル、酢酸nーブチル、酢酸iーブチル、酢酸secーブ チル、酢酸n-ペンチル、酢酸sec-ペンチル、酢酸 3-メトキシブチル、酢酸メチルベンチル、酢酸2-エ チルブチル、酢酸2―エチルヘキシル、酢酸ベンジル、 酢酸シクロヘキシル、酢酸メチルシクロヘキシル、酢酸 n-ノニル、アセト酢酸メチル、アセト酢酸エチル、酢 酸エチレングリコールモノメチルエーテル、酢酸エチレ ングリコールモノエチルエーテル、酢酸ジエチレングリ コールモノメチルエーテル、酢酸ジエチレングリコール モノエチルエーテル、酢酸ジエチレングリコールモノ― nープチルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノメ チルエーテル、酢酸プロピレングリコールモノエチルエ ーテル、酢酸プロピレングリコールモノプロピルエーテ ル、酢酸プロピレングリコールモノブチルエーテル、酢 酸ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、酢酸ジ プロピレングリコールモノエチルエーテル、ジ酢酸グリ コール、酢酸メトキシトリグリコール、プロピオン酸エ チル、プロピオン酸nーブチル、プロピオン酸iーアミ ル、シュウ酸ジエチル、シュウ酸ジ—n—ブチル、乳酸 メチル、乳酸エチル、乳酸nーブチル、乳酸nーアミ ル、マロン酸ジエチル、フタル酸ジメチル、フタル酸ジ エチルなどが挙げられる。これらエステル系溶媒は1種 あるいは2種以上を同時に使用してもよい。 これらの (C) 溶媒は、1種あるいは2種以上を混合して使用す

(C) 溶媒は、1種あるいは2種以上を混合して使用することができる。

【0060】なお、(C)溶媒として、アルコール系溶 媒および/またはケトン系溶媒を用いると、塗布性が良 好でかつ貯蔵安定性に優れた組成物が得られる点で好ま しい。

【0061】本発明の膜形成用組成物は、上記の(C) 溶媒を含有するが、(A) 成分を構成する化合物(1)~(3)を加水分解および/または縮合する際に、同様の溶媒を使用することができる。

[0062] 具体的には、(A) 成分を構成する化合物

(1)~(3)を溶解させた溶媒中に水または上記

(C) 溶媒中で希釈した水を断続的あるいは連続的に添加する。この際、触媒は、溶媒中に予め添加しておいてもよいし、水添加時に水中に溶解あるいは分散させておいてもよい。この際の反応温度としては、通常、0~100℃、好ましくは15~90℃である。

【0063】 その他の添加剤

本発明で得られる膜形成用組成物には、さらにコロイド 状シリカ、コロイド状アルミナ、界面活性剤などの成分 を添加してもよい。コロイド状シリカとは、例えば、高 純度の無水ケイ酸を上記親水性有機溶媒に分散した分散 液であり、通常、平均粒径が $5\sim30\,\mathrm{m}\mu$ 、好ましくは $10\sim20\,\mathrm{m}\mu$ 、固形分濃度が $10\sim40\,\mathrm{m}$ 量%程度の

ものである。このような、コロイド状シリカとしては、 例えば、日産化学工業(株)製、メタノールシリカゾル およびイソプロパノールシリカゾル; 触媒化成工業 (株) 製、オスカルなどが挙げられる。

【0064】コロイド状アルミナとしては、日産化学工業(株)製のアルミナゾル520、同100、同200;川研ファインケミカル(株)製のアルミナクリアーゾル、アルミナゾル10、同132などが挙げられる。界面活性剤としては、例えば、ノニオン系界面活性剤、アニオン系界面活性剤、カチオン系界面活性剤、両性界面活性剤などが挙げられ、さらには、シリコーン系界面活性剤、ポリアルキレンオキシド系界面活性剤、含フッ森界面活性剤などを挙げることができる。

【0065】膜形成用組成物の調製方法

本発明の膜形成用組成物を調製するに際しては、例えば、(C) 溶媒中、(A) 成分を構成する化合物(1)~(3) および(B) 成分を混合して、水を連続的または断続的に添加して、加水分解し、縮合すればよく、特に限定されない。

【0066】本発明の組成物の調製方法の具体例としては、下記①-④の方法などを挙げることができる。

① (A) 成分を構成する化合物 (1) ~ (3)、および (C) 溶媒からなる混合物に、所定量の水を加えて、加水分解・縮合反応を行ったのち、(B) 成分を混合しさ

らに加水分解・縮合反応を行う方法。

行う方法。

- ② (A) 成分を構成する化合物 (1) ~ (3) および (C) 成分からなる混合物に、所定量の水を連続的あるいは断続的に添加して、加水分解・縮合反応を行なったのち、(B) 成分を混合しさらに加水分解・縮合反応を
- ③ (A) 成分を構成する化合物 (1) ~ (3) 、(B) 成分および (C) 成分からなる混合物に、所定量の水を加えて加水分解・縮合反応を行う方法。
- ② (A) 成分を構成する化合物 (1) ~ (3)、(B) 成分および (C) 成分からなる混合物に、所定量の水を連続的あるいは断続的に添加して、加水分解、縮合反応を行なう方法。

【0067】このようにして得られる本発明の組成物の全固形分濃度は、好ましくは、2~30重量%であり、使用目的に応じて適宜調整される。組成物の全固形分濃度が2~30重量%であると、塗膜の膜厚が適当な範囲となり、保存安定性もより優れるものである。なお、この全固形分濃度の調整は、必要で有れば濃縮及び上記

(C) 溶媒による希釈によって行われる。また、本発明の組成物は、貯蔵安定性に優れ、例えば、ガラス製密閉で器中、40℃で1ヶ月放置前後の塗布膜厚の変化を測定した場合、その変化率が10%以内である。

【0068】本発明の組成物を用いて膜を形成するには、まず本発明の組成物を基板に塗布し、塗膜を形成する。ここで、本発明の組成物を塗布することができる基

板としては、半導体、ガラス、セラミックス、金属などが挙げられる。また、塗布方法としては、スピンコート、ディッピング、ローラーブレードなどが挙げられる。本発明の組成物は、特にシリコンウエハ、SiOウエハ、SiNウエハなどの上に塗布され、絶縁膜とすることに適している。

【0069】この際の膜厚は、乾燥膜厚として、1回塗りで厚さ0.05~1.5 μm程度、2回塗りでは厚さ0.1~3 μm程度の塗膜を形成することができる。形成する塗膜の厚さは、通常、0.2~20 μmである。この際の加熱方法としては、ホットプレート、オーブン、ファーネスなどを使用することができ、加熱雰囲気としては、大気下、窒素雰囲気、アルゴン雰囲気、真空下、酸素濃度をコントロールした減圧下などで行なうことができる。この加熱方法としては、形成した塗膜を、①上記(B)成分の分解温度未満の温度で加熱して

(A) 成分を一部硬化させ、次いで上記(B) 成分の分解温度以上の温度から最終硬化温度まで加熱し、低密度の硬化物とする方法、②上記(B) 成分の分解温度以上の温度で加熱を行い硬化させ、低密度の硬化物とする方法などが挙げられる。

【0070】また、上記の(A)成分の硬化速度と

(B) 成分の分解速度を制御するため、必要に応じて、 段階的に加熱したり、窒素、空気、酸素、減圧などの雰 囲気を選択することができる。通常、(B) 成分の分解 温度は、通常、200~450℃、好ましくは200~ 350℃であるので、塗膜は最終的にはこの温度以上に 加熱される工程を含む。この工程は、減圧状態もしくは 不活性ガス下で行われるのが好ましい。

【0071】このようにして得られる本発明の低密度化膜は、膜密度が、通常、 $0.35\sim1.2$ g/c m、好ましくは $0.4\sim1.1$ g/c m、さらに好ましくは $0.5\sim1.0$ g/c mである。0.35 g/c m 未満では、塗膜の機械的強度が低下し、一方、1.2 g/c m'を超えると、低誘電率が得られない。この膜密度の調整は、本発明における膜形成用組成物中の

(B) 成分の含有量により、容易に調整することができる。

【0072】さらに、本発明の低密度化膜は、BJH法による細孔分布測定において10nm以上の空孔が認められず、微細配線間の層間絶縁膜材料として好ましい。この塗膜中の微細孔は、本発明における(B)成分を用いることで達成できる。

【0073】さらに、本発明の低密度化膜は、吸水性が低い点に特徴を有し、たとえば、塗膜を127℃、2.5 atm、100%RH、の環境に1時間放置した場合、放置後の塗膜のIRスペクトル観察からは塗膜への水の吸着は認められない。この吸水性は、本発明における膜形成用組成物中の(A—4)成分の含有量を本発明記載の範囲とする事で達成することができる。

【0074】さらに、本発明の低密度化膜の誘電率は、 低誘電率であり、通常、2.6~1.2、好ましくは 2.5~1.2、さらに好ましくは2.4~1.2であ る。この誘電率は、本発明の塗膜形成用組成物中の

(B) 成分の含有量により調製することができる。

【0075】本発明の低密度膜は、絶縁性に優れ、塗布膜の均一性、誘電率特性、塗膜の耐クラック性、塗膜の表面硬度に優れることから、LSI、システムLSI、DRAM、SDRAM、RDRAM、D一RDRAMなどの半導体素子用層間絶縁膜、半導体素子の表面コート膜などの保護膜、多層配線基板の層間絶縁膜、液晶表示素子用の保護膜や絶縁防止膜などの用途に有用である。【0076】

【実施例】以下、本発明を実施例を挙げてさらに具体的に説明する。ただし、以下の記載は、本発明の態様例を概括的に示すものであり、特に理由なく、かかる記載により本発明は限定されるものではない。また、実施例および比較例中の部および%は、特記しない限り、それぞれ重量部および重量%であることを示している。

【0077】製造例1

(B) (メタ) アクリレート系重合体の調製;容量100m1のフラスコに、イソブチルメタクリレート18.32g、3ー(トリメトキシシリル) プロピルメタクリレート1.68g、アゾピスイソブチロニトリル(AIBN)0.33g、2ーメルカプトエタノール0.20gおよびプロピレングリコールモノメチルエーテル30gを入れ溶解させた。系内を窒素ガスで置換したのち、80℃のオイルバスで加熱しながら、7時間撹拌すると粘稠なポリマー溶液が得られた。GPCでポリスチレン換算の平均分子量を測定すると、数平均分子量が5,000、重量平均分子量が9,000であった。また、SP値の計算値は9.3であった。

【0078】製造例2

(B) (メタ) アクリレート系重合体の調製;上記製造例1において、イソブチルメタクリレート18.32gを用いずにテトラヒドロフルフリルメタクリレート18.32gを用いた他は同様の操作を行い粘稠なポリマー浴液が得られた。GPCでポリスチレン換算の平均分子量を測定すると、数平均分子量が8,400、重量平均分子量が18,100であった。また、SP値の計算値は10.8であった。

【0079】製造例3

(B) (メタ) アクリレート系重合体の調製;上記製造例1において、イソブチルメタクリレート18.32gを用いずに2一ヒドロキシプロビルメタクリレート18.32gを用いた他は同様の操作を行い粘稠なポリマー溶液が得られた。GPCでポリスチレン換算の平均分子量を測定すると、数平均分子量が5,000、重量平均分子量が8,600であった。また、SP値の計算値は12.6であった。

【0080】実施例1

メチルトリメトキシシラン243.6g(完全加水分解 縮合物換算:120.0g)、1,2-ビス(トリエト キシシリル) エタン214.5g (完全加水分解縮合物 換算:80.0g)、製造例1記載の(B) 成分26 9.2g (固形分含有量:40%)、プロピレングリコ ールモノプロビルエーテル559.3g、メチル-n-ベンチルケトン239.7gの混合溶液に、マレイン酸 1. 0g (触媒/SiOR'=0.001mol比)を 比) に溶かした水溶液を室温で1時間かけて滴下した。 混合物の滴下終了後、さらに60℃で2時間反応させた のち、減圧下で全溶液量1,000gとなるまで濃縮 し、固形分含有量20%の膜形成用組成物を得た。得ら れた組成物を8インチシリコンウエハ上にスピンコート 法により塗布し、大気中80℃で5分間、次いで窒素下 200℃で5分間加熱したのち、さらに真空下で340 ℃、360℃、380℃の順でそれぞれ30分間ずつ加 熱し、さらに真空下425℃で1時間加熱し、無色透明 の膜を形成した。さらに、得られた膜を、下記のとおり 評価した。結果を表1に示す。

【0081】膜形成用組成物の評価

1. 貯蔵安定性

本発明における膜形成用組成物80mlを容量100mlのガラス製ねじ口瓶に入れて密閉し、40℃オートクレーブ中で1ヶ月放置した。放置前後のサンブルを2500rpm31秒のスピンコート条件で塗布し、上記実施例1記載の方法で焼成した時の膜厚を光学式膜厚計(Rudolph Technologies社製、Spectralaser200)にて測定し、その変化率{[(放置後のサンブルの膜厚一放置前のサンブルの膜厚)/放置前のサンブルの膜厚]×100}を算出し、下記基準にて評価した。

〇: 膜厚変化率<10%

×:膜厚変化率≥10%

【0082】2. 誘電率

得られた膜に対して蒸着法によりアルミニウム電極パターンを形成させ誘電率測定用サンプルを作成した。該サンプルを周波数100kHzの周波数で、横河・ヒューレットパッカード(株)製、HP16451B電極およびHP4284AプレシジョンLCRメータを用いてCV法により当該塗膜の誘電率を測定した。結果を表1に示す。

【0083】3. 膜密度

密度は、膜の膜厚と膜の面積から求めた体積と、膜の重 量から算出した。

4.細孔分布

得られた硬化物の細孔分布を、COULTER社製 O MNISORP 100/360 SERIESを用い てBJH法で測定し、下記基準に従って評価した。 O:10 nm以上の細孔が認められない。

x:10 nm以上の細孔が認められる。

【0084】5. 弹性率

得られた膜を、ナノインデンターXP (ナノインスツルメント社製)を用いて、連続別性測定法により測定した。

6. 吸水性

得られた塗膜を127℃、2.5 atm、100%R H、の環境に1時間放置し、放置後の塗膜のIRスペクトルを観察した。放置前の塗膜のIRスペクトルと比較して、3,500cm⁻¹付近のH.Oに起因する吸収の有無を観察し、吸水性を下記基準に従い評価した。

〇:吸収無し

×:吸収有り

【0085】7. CMP耐性

得られた膜を、以下の条件で研磨した。

スラリー:シリカ―過酸化水素系

研磨圧力:300g/cm^t

研磨時間:60秒

評価は、以下の基準にて行った。

〇:変化なし

 Δ : 一部にはがれやキズがある。

×:全て剥がれる。

【0086】実施例2

実施例1において、(B)成分として製造例2に記載の組成物を用い、かつマレイン酸1.0gの代わりにシュウ酸0.8gを用いた以外は、実施例1と同様にして、膜形成用組成物を調製した。結果を表1に示す。

実施例3

実施例1において、(B)成分として製造例3に記載の 組成物を用いた以外は、実施例1と同様にして、膜形成 用組成物を調製した。結果を表1に示す。

【0087】実施例4

テトラメトキシシシラン50.7g (完全加水分解縮合 物換算:20.0g)、メチルトリメトキシシラン16 2.4g (完全加水分解縮合物換算:80.0g)、ジ メチルジメトキシシラン32.4g(完全加水分解縮合 物換算: 20.0g)、1, 2-ビス(トリエトキシシ リル) メタン230.5g (完全加水分解縮合物換算: 80.0g)、製造例1記載の(B)成分166.7g (固形分含有量:40%)、プロピレングリコールモノ メチルエーテル798.9gの混合溶液に、マレイン酸 1. 1g (触媒/SiOR'=0.001mol比) を 水171.3g (H.O/SiOR'=1.0mol 比) に溶かした水溶液を室温で1時間かけて滴下した。 混合物の滴下終了後、さらに60℃で2時間反応させた のち、減圧下で全溶液量1,000gとなるまで濃縮 し、固形分含有量20%の膜形成用組成物を得た。 【0088】得られた組成物を8インチシリコンウエハ 上にスピンコート法により塗布し、大気中80℃で5分

間、次いで窒素下200℃で5分間加熱したのち、さらに真空下で340℃、360℃、380℃の順でそれぞれ30分間ずつ加熱し、さらに真空下425℃で1時間加熱し、無色透明の膜を形成した。さらに、得られた膜を、実施例1と同様に評価した。結果を表1に示す。 【0089】実施例5

テトラメトキシシシラン101.3g(完全加水分解縮 合物換算:40.0g)、メチルトリメトキシシラン2 03.0g (完全加水分解縮合物換算:100.0 g)、1,2-ビス(トリエトキシシリル)エタン16 0.9g(完全加水分解縮合物換算:60.0g)、製 造例1記載の(B)成分166.7g(固形分含有量: 40%)、プロピレングリコールモノプロピルエーテル 783.2g、ジーiープロポキシ・ビス (エチルアセ トアセテート) チタン1. 7g (触媒/SiOR'= 0.004mol比) の混合溶液に、水177.5g (H,O/SiOR'=1.0mol比)を60℃加温 下で1時間かけて滴下した。混合物の滴下終了後、さら に60℃で2時間反応させたのち、アセチルアセトン1 00.0gを加え、その後、減圧下で全溶液量1,00 0gとなるまで濃縮し、固形分含有量20%の膜形成用 組成物を得た。

【0090】得られた組成物を8インチシリコンウエハ上にスピンコート法により塗布し、大気中80℃で5分間、次いで窒素下200℃で5分間加熱したのち、さらに真空下で340℃、360℃、380℃の順でそれぞれ30分間ずつ加熱し、さらに真空下425℃で1時間加熱し、無色透明の膜を形成した。さらに、得られた膜を、実施例1と同様に評価した。結果を表1に示す。【0091】比較例1

実施例1において、製造例1に記載の(B)成分を使用しない以外は、実施例1と同様にして組成物を製造し、基板に塗布し加熱して、膜を形成した。得られた膜の評価を、実施例1と同様にして行った。結果を表1に示す。

【0092】比較例2

メチルトリメトキシシラン405.9g (完全加水分解縮合物換算:200.0g)、製造例1記載の(B)成分214.3g (固形分含有量:40%)、プロピレングリコールモノメチルエーテル799.0gの混合溶液に、マレイン酸1.0g (触媒/SiOR'=0.001mo1比)を水161.1g (H·O/SiOR'=1.0mo1比)に溶かした水溶液を室温で1時間かけて滴下した。混合物の滴下終了後、さらに60℃で2時間反応させたのち、減圧下で全溶液量1,000gとなるまで濃縮し、固形分含有量20%の膜形成用組成物を得た。得られた組成物を8インチシリコンウエハ上にスピンコート法により塗布し、大気中80℃で5分間、次いで窒素下200℃で5分間加熱したのち、さらに真空下で340℃、360℃、380℃の順でそれぞれ30

分間ずつ加熱し、さらに真空下425℃で1時間加熱し、無色透明の膜を形成した。さらに、得られた膜を、実施例1と同様に評価した。結果を表1に示す。 【0093】比較例3

実施例1において、製造例1に記載の(B)成分を使用せず、代わりにポリメチルメタクリレート樹脂(分子量

20,000)を使用する以外は、実施例1と同様にして組成物を製造し、基盤に塗布し加熱して膜を形成した。得られた膜の評価を、実施例1と同様にして行った。結果を表1に示す。

【0094】 【表1】

[実施例	比較例	
1	1 2 3 4 5	1 2 3	
貯蔵安定性	10 10 10 10 10	0 0 0 1	
誘電率	2.3 2.3 2.2 2.4 2.4	3.0 2.3 2.5	
膜密度(g/cm²)	1.1 1.1 1.0 1.2 1.2		
細孔分布	10 10 10 10 10		
弾性率 (GPa)	4.1 4.0 3.8 4.9 4.3	9.5 1.8 3.8	
吸水性		0 10 10 1	
CMP耐性		Ο ΙΧ ΙΔ Ι	

[0095]

【発明の効果】本発明によれば、450℃以下での硬化可能であり、得られる膜が均一かつ低密度で、低誘電

率、低吸水性で、CMP耐性に優れ、しかも空隙サイズが小さい、膜形成用組成物を提供することができる。

フロントページの続き

(72)発明者 今野 圭二

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

(72)発明者 塩田 淳

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

(72)発明者 山田 欣司

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

(72)発明者 後藤 幸平

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイ

エスアール株式会社内

Fターム(参考) 4J002 BG042 BG052 BG062 BG072

CD192 CP051 EC036 EC046

EE036 EE046 EH006 EH036

EH146 EH156 EL066 EL086

EP016 EU026 EU076 EU236

FD310 GH00 GP00 GQ01

GQ05

4J038 CG142 CH032 CH042 CL002

DL021 DL031 GA15 JC32

KA06 NA21 PA19 PB09